# 超音波膜厚計 LU-200

Ver.2.5





# 超音波膜厚計 安全上のご注意

超音波膜厚計は安全のための注意事項を守らないと、物的損害などの事故が発生することがあります。

■安全のための注意事項をお守りください。

取扱説明書に記載の注意事項をよくお読みください。

■故障した場合は使用しないでください。

故障および不具合が生じた場合は、必ず当社修理サービス窓口にご相談ください。

### ■警告表示の意味

取扱説明書および製品には、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐため、次のようなマーク表示をしています。マークの意味は 次のとおりです。





● 所定の電源電圧以外で使用しないでください。過電圧を加えると過熱し、故障や火災の原因となります。

超音波膜厚計を分解、改造しないでください。 故障、感電、けがなどの原因となります。故障と考えられる場合は、当社修理サービス窓口へご連絡ください。

(n)

水濡れに注意してください。 本器は防水機構となっていません。本器の内部に水が侵入すると感電、故障の原因となります。

# ▲ 注意

● 電源コード、電源ケーブルを抜き差しするときは、コードを引っ張らず、コネクタ、プラグ部を持って行ってください。

- 操作キーを押しながら、電源スイッチを入れないでください。
- 指定されたキー以外、複数の操作キーを同時に押さないでください。

# 目 次

1.	測定原理と特長	1
2.	各部の名称	З
З.	キーボードの説明	5
4.	仕 様	7
5.	測定の準備	8
6.	測 定	15
7.	ファンクションモード	18
8.	検量線の作り方	28
9.	RS-232C出力	29
10.	各種測定対象の測定法	31
11.	取り扱い上の注意	32

# 1. 測定原理と特長

#### 1-1. はじめに

従来は、金属上に施された塗装などの被膜厚さの測定に、電磁式や高周波式の膜厚計が現 場用として広い分野で利用されてきました。しかし近年、これらの方式では原理的に測 定ができない樹脂等の非金属上の被膜厚測定が強く要望されるようになってきていま す。また金属上であっても非常に薄い下地のため、従来の膜厚計では十分な精度を得る ことが困難なものもありました。

そこで、これらの要求に応えるために研究を重ね、開発したのがこの超音波を利用した膜 厚計LU-200型です。

#### 1-2. 測定原理

超音波は、音響的性質の異なる二つの物質の 境界面における反射によって発生します。 超音波式の膜厚計はこの原理を利用したも のです。

図-1は超音波測定の原理を示したもので、センサ内部の振動子で発振された超音波は一部は遅延材を介して被膜に入射し、他はこの境界で反射します。



さらに、遅延材を通過した超音波の一部は、 被膜の内部を伝播し、下地との境界をそのま

ま透過し、他は反射して再び被膜、遅延材を通過してセンサ内部に戻ります。 これらの超音波のうち、被膜に入射して下地との境界で反射し、再び被膜から遅延材に入 射する超音波の所要時間を測定することによって、被膜の厚さを知ろうというのが、この 超音波膜厚計の原理です。

しかし、実際にはさまざなま被膜を通過する超音波の速度、つまり音速を知ることは容易 ではありません。そこで本器では、事前に被膜の厚さと上記の超音波の所要時間との関 係から検量線を作成し、これを利用する方法を用いています。

### 1-3.特 長

- ① 演算処理によって細かな分解能と高い測定精度が実現しました。
- ② 特殊な構造のプローブにより、被膜表面への密着が確実となり高い再現性が得られます。
- ③データメモリ、データ出力、統計計算などの機能を内蔵しています。

### 1-4. 測定対象

原理的には、下地と被膜との間に音響特性(音響インピーダンス)の差があれば、樹脂上や 金属上の塗装以外にも、モルタルなどの無機質材の上の塗装の測定も可能です。

#### 1-5. 検量線

(1)概 要

測定原理の項でもふれましたが、超音波を利用して膜厚を測定するためには、測定対象ご とに検量線を設定しなければなりません。この検量線に最も影響を与えるのは被膜の音 速ですが、層構成などが関係することもあります。

(2)検量線の作成

過去に、これから測定しようとする物と類似のサンプルによる検量線が作られていれば、 それを確認のうえ利用することができますが、該当するものがないときには新たに作成 する必要があります。

弊社に検量線の作成を依頼される場合には、サンプルの提供、被膜と下地の材質並びに被 膜の層構成の概要についての情報提供が必要です。

それらの情報を基に、いくつかの測定点の超音波膜厚計の測定値と、顕微鏡などによる測定値から検量線を作成します。

図-2は顕微鏡による断面写真でバンパーの塗装厚を測定した例です。



図-2

6

### (3)検量線の膜厚計への設定方法

検量線は、付属の標準サンプルを用いてキャリブレーションを行うことによって、膜厚計 に設定することができます。

別紙の検量線一覧表には測定対象ごと、標準サンプルごとに、キャリブレーションのとき に設定する膜厚が記載されています。この中から該当する膜厚をキー入力します。

2-1.本体



<正面>

<側面>

<背面>

2-2. プローブ



2-3. 付属品







A.C.アダプタ

アルカリ乾電池(単3)×6

プローブ







ケーブル

カップラント(ソニコートBS)

カップラント容器



標準サンプルセット(5枚組)



3. キーボードの説明

DATE 7	LOT 8	DEL 9	RESET
B.R 4	F.R 5	RANGE 6	FUN
B.INC 1	A.C 2	$\mu$ m/mils <b>3</b>	CAL
APPL.NO.		C	data trans ENT

RESET	リセットキー	これを押すと測定のモードに戻ります。 操作の途中で中止するときに使用します。
CAL	キャリブレーションキー	キャリブレーション(調整)を行うときに押します。
data trans ENT	エンターキー	DATE,LOT,CAL,LIMIT操作で数字を入力するときに 押します。 また、B.R,B.INC,A.Cを用いた後で、次のステップに進 むときに押します。
C	クリアキー 測定条件設定キー	数字データを入れ間違えた場合などに押します。 また、キャリブ レーションの際に測定ミスしたデータを 削除するときに押します。

測定の際の内部設定を変更するときにも使用します。

FUN	ファンクション・キー	二重定義のファンクション・モード(日付、ロット番号、統 計結果等)を用いるときに押します。 ファンクション・モードには次の種類があります。
DATE 7	デイト・キー (日付キー)	日付を入力するときに押します。
LOT 8	ロット・キー	ロット番号を入力するときに押します。
DEL 9	デリート・キー (消去キー)	誤って測定した測定データをデータメモリから除くとき 押します。
B.R 4	ブロック・リザルト・キー (ブロック結果キー)	ブロック毎の統計計算をするときに押します。
F.R 5	ファイナル・リザルト・キー	測定回数N = 1 から最終回数までの統計結果を求めると きに押します。
RANGE 6	レンジ設定・キー	測定範囲の上、下限を設定するときに押します。 設定された範囲外は測定不能となります。
B.INC 1	ブロック・インクリメント・キー (ブロック変更キー)	ブロック番号を変更するときに押します。
A.C 2	オール・クリア・キー (全消去キー)	記憶している測定データや各種コメントをすべて消去す るときに押します。
$\mu$ m/mils <b>3</b>	単位変更キー	単位をµmからmilsに変更するとき、またはその逆を行 うときに押します。
APPLNO.	アプリケーション・ナンバー・キー	キャリブレーション(検量線)を記憶しているナンバーを 確認したり、変更するときに押します。
LIMIT	リミット・キー	アラームを出す範囲の上・下限の設定をするときに押し ます。

# 4. 仕 様

- 測 定 方 式 : 超音波反射式
- 測 定 対 象 : 樹脂、金属などの上に施された被膜
- 測 定 範 囲<sup>\*1</sup> : 10~700µm (表示範囲5~700µm)
- 測 定 精 度\*1 : 50µm未満 ±2µm以内
   50µm以上 ±4%以内
- 分解能 : 1μm
- 統 計 機 能 : 測定回数、平均值、標準偏差、最大值、最小值
- 表示 : ドットマトリックスLCD
- 外部出力 : RS232C
- 電 源 : AC100V(50/60Hz)または、電池1.5V(単3)×6本
- 消費電力 : 定常時0.9W / 測定時2.5W
- 寸 法 :本 体: 120(W)×250(D)×55(H)mmプローブ: 63φ×85(H)mm
- 質量:本体:0.8kgプローブ:0.22kg
- 使用温度範囲 : 10℃~35℃
- 付 属 品 : ACアダプタ、アルカリ乾電池(単3×6)、プローブ、ケーブル、 カップラント(ソニコートBS<sup>\*2</sup>)、カップラント容器、標準サンプルセット(5枚組) ソフトケース、
- オプション : プリンタ(VZ-330)
  - \*<sup>1</sup> 測定範囲、測定精度は測定対象により異なります。 掲げた数値は校正、管理のため製作した標準サンプルを測定した場合です。
  - \*<sup>2</sup> ソニコートBSの成分は、グリセリン、界面活性剤、増粘剤、水です。

# 5. 測定の準備

5-1. 電源の用意

交流100Vまたは電池のどちらでも使用できます。

(1) 交流100Vを使用する場合



本体の電源スイッチをOFFにし、付属のACアダプタソケットに差し込みます。 その後にACアダプタを100V電源コンセントに接続します。

\* AC100V以外の電源を使用するときは、弊社までご相談ください。)

#### (2) 乾電池を使用する場合

本体の電源スイッチがOFFであることを確認してから、裏面の電池ボックスに乾電池 (1.5V単3アルカリ)を6本、入れます。

\* ⊕ ─ の方向に注意して正しく入れてください。

#### (3) 交流電源と電池を併用する場合

電池を本体に収納したままACアダプタを接続すると、自動的にAC電源側から電力が供給されます。

5-2. プローブの接続

ケーブルのコネクタを本体側面のソケットに軽 く押しながら回すと、本体のガイド溝に合った ところで簡単に入ります。

プローブ側も同様に入れます。(図-3参照)







本体からケーブルを外す場合は、必ずケーブル の本体側に近い金具部品を引き抜きます。 黒いコードの部分を持って引き抜こうとしても 外れませんし、故障の原因になります。 プローブ側も同様です。(図-4参照)



5-3. 電源投入

電源スイッチをONにします。

### 5-4. キャリブレーションについて

測定の前に必ずキャリブレーションが必要です。

キャリブレーションには標準サンプル、または測定しようとするものと同じ材料、同じ層 構造で膜厚が既知のサンプルを使用します。

標準サンプルは5個付属しており、測定対象によって使用する標準サンプルが異なります。 検量線一覧表の測定対象の欄に設定値が記載されている標準サンプルを使用します。 同じ標準サンプルであっても測定対象によりキー入力する設定値は異なります。

標準サンプルの測定



6





- \* 図-7のような状態のままで測定すると、正常な測定値が得られません。一度、センサホルダから手を離すと、もしも標準サンプルの内側の壁面に引っかかっていても、下に落ちて図-6のように、測定に 適した状態になります。
- ④ 図-8のように、センサホルダをブザーが鳴るまで押しつけます。
   ブザーは2回鳴ります。1回目で測定が終了します。



かって傾いている

- \* このときにセンサホルダが傾かないように注意してください。
- ⑤ 1枚の標準サンプルを7回以上測定します。
   1回の測定ごとに必ずプローブを標準サンプルの測定面から引き離します。



- \* 図-9のように、標準サンプルにのせたままセンサホルダだけを上下 して測定を繰り返ことはおやめください。測定部が常に同じ場所 であるため、平均的なデータが採取されません。
- \* 測定値の信頼性維持のため標準サンプルの設定値を定期的(18ヵ 月に1度)に校正する必要があります。弊社にお申し付けください。

図-8

図-9

- ルの測定
  ① 標準サンプルの測定面と、センサの端面のゴミ、ホコリ等をふき
  取ります。
  - \* これらをはさみこんで測定すると誤差が生じることがあります。
  - ② センサ端面または標準サンプルの測定部位にカップラントを塗 布し、センサホルダを標準サンプルの測定面に正しくのせます。
     (図-6参照)



- \* カップラントが塗布された状態で長時間放置するとゴミ、ホコリ等 が付着することがあります。カップラントは、測定の直前に塗布し てください。
- ③ センサホルダが正しく標準サンプルにのせられていることを確認してください。

### 5-5. 検量線の登録

製品概要の項でも説明しましたが、超音波膜厚計では測定対象ごとに検量線を設定する 必要があります。

それらの検量線はAPPL.NO.(アプリケーション・ナンバー)の0~9まで、10種類を登録することができます。

測定前に、測定しようとする測定対象物の検量線を設定します。

### ◆ 操作例: APPL.NO.を1に設定します。

手順	キー 操 作	表示部	操作の説明
1	FUN	FUNCTION	
2	APPL.NO.	INPUT THE APPLICATION NO.0-9 9 ?	前回指定したNO.が表示されます。
3	B.INC 1	INPUT THE APPLICATION NO.0-9 1 ?	アプリケーションナンバーを入力します。
4	DATA TRANS ENT	BLOCK=01 N=0007 MEA JUTTN	

# ◆ 操作例:いま選択したAPPL.NO.1に、樹脂バンパー上の塗装測定の検量線を設定します。

手順	キー操作	表示部	操作の説明
1	CAL	MASTER INF WIPE THE PROBE CLEAN & PRESS THE ENT	まず、センサ先端部のゴミ、カップラントをきれ いにふき取ってください。
2	data trans ENT	MEASURING ***** MEASURE THE CALIBRATION SAMPLE STD1	1分程度待った後に、プローブを空中に向けて <sup>™™™™</sup> を押します。
3	測定	MEASURING CAL ***** APPL1 STD1 CAL 25 JUM MEASURING CAL ***** APPL1 STD1 CAL 26 JUM	使用する標準サンプルのうち、最も薄いものを7 回以上測定します。 * 測定をせずに たます。を押すと、測定のモードに戻 ります。このときは手順2までは有効ですが、手順 3以降は前の設定がそのまま残ります。
4	DATA TRANS ENT	INPUT SAMPLE THICKNESS STD1 µM?	
5	A.C LOT <b>8</b>	INPUT SAMPLE THICKNESS STD1 28µM?	検量線一覧表から使用する検量線を選択して、該 当る標準サンプルの設定値を入力します。*1
6	DATA TRANS ENT	MEASURE THE CALIBRATION SAMPLE STD2	
7	測定	MEASURING CAL ***** APPL1 STD2 CAL 45 J.M	使用する標準サンプルのうち二番目に薄いもの を7回以上、測定します。 * 測定をせずに きます。 ります。このときは手順6までは有効ですが、手順 7以降は前の設定がそのままメモリに残ります。
	測定	MEASURING CAL ***** APPL1 STD2 CAL <b>46 JUTN</b>	



- \*1 検量線を作成するための実験を行うときは、検量線作成の欄に記載された設定値を使用してくだ さい。
- \*2 標準サンプルではなく、測定するものと同じ材料、層構造で膜厚が既知のサンプルを使用して キャリブレーションをするときは、その膜厚を入力してください。

### 5-6. 検量線のコピー

他のアプリケーションNO.の測定データをコピーするもできます。 あらかじめ他のアプリケーションNO.でキャリブレーションがされてあり、そのときと 同じ標準サンプルを使用してキャリブレーションを行う場合、プローブを空中に向けて 行うMASTER INF測定と標準サンプルの測定を省略することができます。

◆ 操作例:APPL.NO.2のSTD2の測定値をAPPL.NO.1にコピーします。

手順	キー 操 作	表 示 部	操作の説明
1	CAL	MASTER INF WIPE THE PROBE CLEAN & PRESS THE ENT	
2	C	MEASURE THE CALIBRATION SAMPLE STD1	MASTER INFの測定を行いません。すでに測 定してメモリされているデータを使用します。
3	A.C 2	APPL1 STD1 COPY APPL. 2 CAL -> APPL. 1?	すでに測定されているAPPL.NO2のSTD1の 測定値をAPPL.NO.1にコピーします。
4	DATA TRANS ENT	INPUT SAMPLE THICKNESS STD1 µm?	
5	A.C LOT <b>8</b>	INPUT SAMPLE THICKNESS STD1 28µM?	検量線一覧表から使用する検量線を選択して、該 当する標準サンプルの設定値をキー入力します。
6	DATA TRANS ENT	MEASURE THE CALIBRATION SAMPLE STD2	
7	A.C 2	APPL1 STD2 COPY APPL. 2 CAL -> APPL. 1?	すでに測定されているAPPL.NO2のSTD2の 測定値をAPPL.NO.1にコピーします。
8	DATA TRANS ENT	INPUT SAMPLE THICKNESS STD2 µM?	
9	B.R LOT <b>8</b>	INPUT SAMPLE THICKNESS STD2 48µM?	検量線一覧表から使用する検量線を選択して、該 当する標準サンプルの設定値をキー入力します。
1	DATA TRANS ENT	MEASURE THE CALIBRATION SAMPLE STD3	
1	A.C 2	APPL1 STD3 COPY APPL. 2 CAL -> APPL. 1?	すでに測定されているAPPL.NO2のSTD3の 測定値をAPPL.NO.1にコピーします。

手順	キー 操 作	表示部	操作の説明
12	DATA TRANS ENT	INPUT SAMPLE THICKNESS STD3 µM?	
(13)	LOT B.INC 1	INPUT SAMPLE THICKNESS STD3 81µM?	検量線一覧表から使用する検量線を選択して、該 当する標準サンプルの設定値をキー入力します。
14)	DATA TRANS ENT	BLOCK=01 N=0007 MEA JUTT	

- \*1 キャリブレーションのときの測定値は平均値を表示します。
- \*2 測定ミスがあった場合は、測定値が突然それまでの値(平均値)から大きく離れます。

このときは c キーを押して、最新の測定値を削除してください。

\*3 標準サンプルの設定値入力する場合、間違った数字キーを押したときは、訂正用の \_\_\_\_ キーを 押してから再入力します。

ただし、 **LATTAINS** キーを押した後では、修正はできませんので、再度 **RESET** キーを押して、 初めからやり直します。

\*4 標準サンプルの測定値とキー入力する設定値は、各アプリケーションごとに別々にメモリされま すが、MASTER INFのデータは1種類だけが設定可能です。したがって、MASTER INFの測 定を行うと、使用しているすべてのアプリケーションNO.のMASTER INFが更新されます。

### 6. 測 定

6-1. 測定の手順

(1) 電源スイッチをONにします。

- (2) APPL.NOを選択します。
- (3) キャリブレーションを行います。
- (4) 必要に応じてRANGE設定、側手条件設定を行います。
- (5)日付、LIMIT設定、ロット番号などのコメントを入力します。
- (6) カップラントの塗布

超音波は空気により大きな減衰を受けるため、センサと被膜の間にすきま(空間)がある と超音波が著しく減衰して測定が困難となります。そこで、このすきまを埋めるために カップラントをセンサまたは測定被膜表面に塗布します。

\* 1 カップラントは、必ず付属のソニコートBSをお使い ください。



他のカップラントを使用した場合、測定値が異なった り、再現性が劣化することがあります。



- \*2 常温以上では使いやすい粘度ですが、温度が低下する と多少硬くなることがあります。 硬すぎるとセンサと測定する被膜との間に厚いカップ ラントの膜ができ、測定誤差となる恐れがあります。 水を混ぜて流れない程度に軟らかくしてから使用し てください。
- \*3 カップラントの塗布量は図-10に示す程度が適当で すが、多少多めでも問題はありません。 特に同一箇所を続けて何回か測定するときは、多めの 方がカップラントが確実にセンサと被膜の間に介在 して安定して測定できます。
- \*4 カップラントはカップラント容器に移し替えて使用 すると、塗布する量の調整が簡単になります。 図-11のように、カップラント容器の外ふた、中ふた を外し、容器の中の空気を押し出して(①)から、 チューブに入ったソニコートBSを押し出しながら、 カップラント容器に吸い込むように(②)して移し替 えます。







図-11

\*5 センサの先端や標準サンプルに残ったカップラント は、柔らかい布などでふき取ってください。 測定した被膜からカップラントを除去するには、水を 含んだティッシュペーパーなどが有効です。 アルコール等の溶剤は決して使用しないでください。 表面の塗膜を溶かしてしまう恐れがあります。



\*6 ソニコートBSは、グリセリン、海面活性剤、増粘剤、水 からできており、通常の取り扱いでは危険はありませ んが、目に入ったり、飲み込んだ場合は、水で洗い流し たうえ医師の診断を受けてください。 手に付着した場合は、十分に洗い流してください。

(7)測 定 プローブを図-22のように、真上から測定面に 押し当てるようにして測定します。



図-22

\*1 曲面の測定方法 図-23を参考にして、プローブのスライドベースのV カット部分を曲面に当てるようにして測定します。 スライドベースが措定曲面上を滑って、移動しないよ うに注意してください。





\*2 プローブは、常に測定面に対して真上から押し当てる ようにしてください。(図-24参照) 斜め方向から押し当てたり、押し当てた状態で横滑り させると、測定誤差が生じることがあります。



\*3 測定の前にはセンサや測定面のゴミ、ホコリを取り除いておいてください。センサと測定面の間にゴミなどが挟み込んでいると、測定誤差の原因となります。 プローブ側も同様に入れます。



図-24

# 6-2. 測定値の表示

### (1) 通常の測定値

手順	キー操作	表示部	操作の説明
1	測定	BLOCK=01 N=0007 MEA 48 JUM	

# (2) ファンクションモードで層別表示、2層指定がされている場合

手順	キー 操 作	表示部	操作の説明
1	測定	BLOCK=01 N=0007 P1 15 MEA* P2 33 µm	2層目が採用に指定されている場合
2	DATA TRANS ENT	вьоск=81 N=8887 МЕА 48 JUM	総厚が表示されます。
3	DATA TRANS ENT	BLOCK=01 N=0007 P1 15 MEA* P2 33 μΜ	

\* 上記の例では、P1が最も上の層(表面)、P2がその下の層の膜厚を表示しています。

# 7. ファンクションモード

日付やロット番号、統計結果などを操作するときに、ファンクション・モードを用います。

# (1) DATE (デイト・キー)

日付をメモリに記憶させるときに使用します。

誤って入力したときは、 c キーを押して再度数字を入力します。

手順	キー 操 作	表示部	操作の説明
1	FUN	FUNCTION	
2	DATE 7	INPUT DATE ?	日付を入力します。
3	APPLNO. 0 APPLNO. 0 LIMIT LIMIT 1 LIMIT LIMIT 1 LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMIT LIMI	INPUT DATE 00.11.12 ?	
4	DATA TRANS ENT	BLOCK=81 N=8807 MEA JJIN	

# (2) LOT (ロット・キー)

ロット番号をメモリに記憶させるときに使用します。

手順	キー 操 作	表示部	操作の説明
1	FUN	FUNCTION	
2	LOT 8	INPUT LOT ?	ロット番号を入力します。
3	APPLNO. 0 0 RANGE 6 8 8	INPUT LOT 0064 ?	
4	DATA TRANS ENT		

(3) \_\_\_\_\_ DELETE (デリート・キー)

誤って測定した測定値を統計計算データに入れたくないときに使用します。 \* ここでは、以前に求めたブロック統計計算の変更はできません。

手順	キー 操 作	表示部	操 作 の 説 明
1	FUN	FUNCTION	
2	DEL 9	INPUT DELETE DATA NO.	
3	F.R 5 F.R 5	INPUT DELETE DATA NO. 55 ?	
4	DATA TRANS ENT	BLOCK=01 N=0007 MEA <b>J.(M</b>	

# (4) B.R (ブロック・リザルト・キー)

ブロックごとの統計計算を求めるときに使用します。 \* ブロック内の測定データ回数が2回以上でないと、統計計算はできません。

手順	キー 操 作	表示部	操作の説明
1	FUN	FUNCTION	
2	B.R 4	BLOCK RESULT N=0001-0018	N=1から18までのデータを計算します。
3	B.R <b>4</b>	BLOCK=01 N=0001-0018 B.R/AV <b>81µm</b>	AV(平均)を表示します。
4	B.R 4	BLOCK=01 N=0001-0018 B.R/S <b>1.5 µm</b>	S(標準偏差)を表示します。
5	B.R <b>4</b>	BLOCK=01 N=0001-0018 B.R/MAX 81 MM	MAX(最大値)を表示します。
6	B.R <b>4</b>	BLOCK=01 N=0001-0018 B.R/MIN <b>78 Jim</b>	MIN(最小値)表示します。
7	B.R <b>4</b>	INPUT THE BLOCK NO. 1>2 ?	
8	RANGE 6	INPUT THE BLOCK NO. 1>6 ?	
9	DATA TRANS ENT	BLOCK=06 N=0019 MEA JLIN	

\* 次のブロックに移す場合(この例では1から2に移す場合)は、手順⑦から、手順⑧を飛ばして、 手順⑨を行います。

#### 統計計算内容

測定回数	Ν
ブロック番号	BLOCK
平均値	AV
標準偏差	S
最大値	MAX
最小値	MIN

統計計算方法

(5) **F.R** (ファイナル・リザルト・キー)

測定回数N=0001から最終回までの全体の測定データの統計結果を求めるときに使用します。

手順	キー 操 作	表示部	操作の説明
1	FUN	FUNCTION	
2	F.R 5	FINAL RESULT N=0001-0018	
3	F.R 5	BLOCK=01 N=0001-0018 F.R/AV 81µm	
4	F.R 5	BLOCK=01 N=0001-0018 F.R/S <b>1.5 µm</b>	
5	F.R 5	BLOCK=01 N=0001-0018 F.R/MAX 81 Jum	
6	F.R 5	BLOCK=01 N=0001-0018 F.R/MIN 78 MM	
1	F.R 5	INPUT THE BLOCK NO. 1>2 ?	
8	RANGE 6	INPUT THE BLOCK NO. 1>6 ?	
9	DATA TRANS ENT	BLOCK=06 N=0019 MEA JLIN	

\* ファイナル・リザルトを求めても、それまでのデータは記憶し続けます。したがって、データ転送 によって出力させることができます。

(6)  $\begin{bmatrix} RANGE \\ 6 \end{bmatrix}$  RANGE ( $\nu \nu \vec{\nu} \cdot \vec{\tau} - \vec{\nu}$ )

測定範囲の上・下限を設定するときに使用します。

\* 設定された範囲外では測定不能となりますが、範囲を狭く設定した方が、測定時間を短くでて、 また不要なノイズによる測定を防止できます。最適な範囲を設定してください。



ブロック番号を変更するときに使用します。

たとえば、ブロック・リザルトを求めずにブロック番号を次のブロックや、任意のブロックへ移動させて 測定を続けるときなどに用います。

手順	キー 操 作	表示部	操作の説明
1	FUN	FUNCTION	
2	B.INC 1	INPUT THE BLOCK NO. 1>2 ?	
3	RANGE 6	INPUT THE BLOCK NO. 1>6 ?	
4	DATA TRANS ENT	BLOCK=01 N=0007 MEA JUM	

# (8) \_\_\_\_\_A.C (オール・クリア・キー)

記憶している測定データや、各種コメントをすべて消去するときに使用します。

\* 多くのデータやコメントが蓄積され、メモリがすべて使用されてしまうと、"MEMOLY IS FULL"と表示され、測定が不能となります。このときに使用してください。

手順	キー 操 作	表示部	操作の説明
1	FUN	FUNCTION	
2	A.C 2	ALL CLEAR SURE ?	
3	DATA TRANS ENT	BLOCK=80 N=8080 MEA JUTH	

# (9) µm/mils (単位変更キー)

単位をµmからmilsに、あるいはmilsからµmに変更するときに使用します。

手順	キ ー 操 作	表示部	操作の説明
1	FUN	FUNCTION	
0	$\mu$ m/mils <b>3</b>	UNIT CONVERSION µm>mils?	milsからµmへ
		UNIT CONVERSION mils>µM?	µmからmilsへ
(3)	DATA TRANS ENT	BLOCK=01 N=0007 MEA mils	milsの設定
9		BLOCK=01 N=0007 MEA	µmに設定

# 

キャリブレーション(検量線)を記憶しているナンバーを確認したり、変更するときに使用します。

手順	キー 操 作	表示部	操作の説明
1	FUN	FUNCTION	
2	APPLNO. 0		
3	DATA TRANS ENT		

(11) LIMIT (リミット・キー)

測定膜厚が特定の範囲に収まっているかどうかを判断するときに、この上・下限を設定します。

上・下限範囲から外れた測定データには電子音が鳴り、マークを表示します。

\* RANGEの設定と異なり、設定範囲外でも測定は行います。

手順	キー 操 作	表示部	操作の説明
1	FUN	FUNCTION	
2	RANGE 6	INPUT ALARM UPPER LIMIT 200 µM?	
3	B.INC <b>1</b> F.R <b>5</b> <b>APPLNO.</b> <b>0</b>	INPUT ALARM UPPER LIMIT 150 µM?	リミットの上限値を入力
4	DATA TRANS ENT	INPUT ALARM LOWER LIMIT 20 µm?	

# (12) 測定条件設定キー

測定の際の内部設定を変更するときに使用します。 設定は、感度設定と層数設定の2種類があります。

> \* 測定対象の性質に合わせて、この機能を使用すると測定対象の材質、構造などにより測定が困難 な場合でも、信頼度の高い測定が可能となることがあります。

### 12-1. 感度の設定

被膜の材質や被膜と下地の境界の状態によって超音波の反射が小さく、通常の設定では測 定できないことがありますが、この機能を使用すると、小さな反射波でも検出できます。 0~9の範囲で設定し、数字が大きくなるに従って感度が高くなります。

手順	キー 操 作	表示部	操作の説明
1	FUN	FUNCTION	
2	C	INPUT OPTION NUMBER 1-2 2 ?	前回、指定されたOPTION NO.が表示されます。 1 :感度(しきい値)設定 2 : 層数設定
3	B.INC 1	INPUT OPTION NUMBER 1-2 1 ?	1:感度(しきい値)設定を選択します。
4	DATA TRANS ENT	INPUT SENSITIVITY 0-9 5 ?	前回、指定した感度(しきい値)が表示されます。
5	μm/mils 3	INPUT SENSITIVITY 0-9 3 ?	設定値を入力します。
6	DATA TRANS ENT	APPL1 N=0007 MEA <b>Juïn</b>	



\* 感度を不用意に高く設定すると、不必要なノイズを検出して、測定しようとする厚さとは関係の ない数値が表示されてしまう恐れがあります。測定可能な範囲で、低めの設定をするようにして ください。通常は5程度で使用してください。

### 12-2. 被膜の層数の設定

通常の設定では、被膜の総厚の測定を行いますが、いくつかの層が重なって被膜が構成されている場合、それぞれの層の厚さを別々に表示させることができます。

手順	キー操作	表 示 部	操作の説明
1	FUN	FUNCTION	
2	C	INPUT OPTION NUMBER 1-2 1 ?	前回、指定したOPTION NO.が表示されます。 1 :感度(しきい値)設定 2 : 層数設定
3	A.C 2	INPUT OPTION NUMBER 1-2 2 ?	2:層数設定を選択します。
4	DATA TRANS ENT	INPUT NUMBER OF LAYER 1-3 3 ?	前回、指定した層数が表示されます。
5	$\mu$ m/mils <b>3</b>	INPUT NUMBER OF LAYER 1-3 1 ?	設定する層数を入力します。
6	DATA TRANS ENT	INPUT SELECTED LAYER 1-3 2 ?	
7	A.C 2	INPUT SELECTED LAYER 1-3 2 ?	測定のときにデータをメモリに記憶する層(例で は2層目)を指定します。 Oを入力すると層厚指定となります。
8	DATA TRANS ENT	APPL1 MA.CAL1 N=0007 MEA JUTH	

\*1 通常は、塗装の層同士の境界からの反射波は、塗装と下地の境界からの反射波に比べて小さいことが多いため、感度を高めに設定しなければ検出できないこともあります。

\*2 また、感度を最大に設定しても検出不能であったり、関係のないノイズを検出することもあるため、この機能を利用するときは十分に注意してください。

# (13) DATA TRANS ENT (データ転送エンター・キー)

DATE, LOT, CAL, LIMIT操作で数字を入力するときに押します。 また、B.R, B.INC, AA.Cを用いた後で、次のステップに進むときに押します。 さらに、測定値や統計計算結果、入力された日付、ロット番号などは内部に記憶されており、RS232Cに よってコンピュータや専用のプリンタ(オプション)に出力するときに使用します。

手順	キー 操 作	表示部	操 作 の 説 明
1	FUN	FUNCTION	
2	DATA TRANS ENT	DATA TRANS B.R N=0001-0008 B.R N=0009-0018 B.R N=0019-0025 B.R N=0026-0055 F.R N=55	
3		BLOCK=01 N=0000 MEA <b>j.(în</b>	

# 8. 検量線の作り方

ユーザーご自身で検量線を作成することができますので、その手順を説明します。 \* ただし、サンプルをカットして顕微鏡などで膜厚測定をする技術、設備などが必要です。

### 8-1. キャリブレーション

まず、キャリブレーションを行ってください。 設定する検量線は、検量線一覧表の検量線制作 用を使用します。 設定値をそれぞれxs1、xs2、xs3とします。

### 8-2. 膜厚計による測定

いくつかの膜厚の異なるサンプルを超音波膜厚 計で測定します。(データをXiとします) 層別の測定をする場合は、層別表示の指定をし て測定してください。(目的とする層[P1~P3 のどれか1層]の測定値をXiとします)

### 8-3. 顕微鏡による測定

超音波膜厚計で測定した箇所をカットして断面 を露出させます。その断面を、顕微鏡などで測定 し、データYiとします。



\* このとき、正確な膜厚を測定するため、断面が 破壊、変形しないように注意してカットします。

8-4. 回帰式

XiとYiで直線回帰します。(図-25)



### 8-5. 検量線一覧表

xsl、xs2、xs3のそれぞれに相当するysl、 ys2、ys3の値を検量線一覧表に記入します。

表-1 検量線一覧表

	キャリブレーションのための設定値(μm)														
測定対象	標準サンプルA	標準サンプルB	標準サンプルC	標準サンプルロ											
検量線作成用	xsl	xs2	хsЗ												
バンパー/ソリッド															
バンパー/メタリック															
•															
•															
•															
検量線作成サンプル	ys1	ys2	ys3												

### 8-6. 検量線の設定

ys1、ys2、ys3を使ってキャリブレーションを 行えば、検量線を膜厚計に設定することができ ます。

\* 層別表示を利用して検量線を作った場合は、測定 のときも層別表示を設定してください。

XiとYiの関係が直線でない場合は、xsl、xs2、 xs3で折れ曲がる折れ線近似で同様なグラフを 作ります。

# 9. RS-232C出力

コンピュータやオプションの専用プリンタに、統計値や測定結果などを出力することが できます。

### 9-1. 出力仕様

データ出力	:	RS-232C
ボーレート	:	2400bps
データビット長	:	8ビット
パリティ	:	なし
XON/OFF	:	なし

### \* 専用プリンタに接続するときには、プリンタをこの出力仕様に合わせて設定してください。 設定方法は、プリンタの取扱説明書を参照してください。

### 9-2. 出力例

桁数 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
* * * * * * * * * * *		* *		D L	A O	T T	Е			0	0		0	6		2 1	5 0								
	* * * * * * *			P	P R R L L Y Y O		· N N M M N S k	NGG - UE	O E E T T M L		=	1	3 1	0 1	1 0 5 0 5		µ µ µ	m m m	m						
		Б	N			K 0 0 0 0 0		1 0 0 0	2 3 4 5		U	3	3	2 3 3 3 2 3 2 3 1	μ	Μ μ μ μ	m m m m								
	*	*	*	*		В	L	0	С	K		R = =	E	S	U 0 3	L 0 2	Т О О	1 5 0		Ц	m				
		* 8	в	I	0	M M C	A   K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	S X N	S = X = N =			1	ō	3 3	7 3 1		μ μ μ	m m m	m m						
*	Ŧ							0 0 0 1 1 1	6 7 8 9 0 1 2		! ! ! !	I	1 1 1 1 1	1 1 2 1 5 1	7 7 6 0 5 8 6		µ µ µ µ µ и	m m m m							
	*		В	Ĺ	0	C	K	N	R = -	Е	S	U 0 0	L O O	Ť O 1	62	_	_	_							
					N	=	0 M	A A	1 V S V	1 = = =				D 1 1	E 1 2	L 7 7 0	E	і µ µ ц	E m m m						
		*	k	F	Ι	Ν	M A	I L	N N	= R =	Е	S	U O	i L O	ī T O	5		μ μ	m						
					Ν	=	0	O A	1 V S	1 = =			0 7 4	U D 8 4	E	2 L 3 3	Е	Τ μ μ	E m m						
									M M	A I	X N	=				1	2 3	0 1		$_{\mu}^{\mu}$	m m				

### 9-3. データコード例

### 9-4. ケーブル結線例





# 10. 各種測定対象の測定法

#### 10-1. 下地が薄い場合

下地が極端に薄い場合、測定値として"被膜の膜厚+下地の厚さ"が表示されることがあります。以下の2つの方法のいずれかで対処してください。

- (1) ファンクション・モードの"RANGE" 設定の最大値を、想定される被膜の厚さの最 大よりも多少厚めに設定して測定します。設定値の範囲外の測定値は表示されま せん。
- (2) 測定しようとする被膜の膜厚の最大値が"被膜の膜厚+下地の厚さ"の最小値より 大きい場合は、上記①の方法では測定できないことがあります。 このときは、ファンクション・モードの"被膜の層数の設定"を2に設定してください。測定値はp1に表示されます。

#### 10-2. 下地と被膜の境界があいまいな場合

ABS上の塗装などでは、下地と被膜の境界があいまいとなっているため、超音波の反射が小さく、通常の測定条件では測定できないことがあります。このようなときは、ファンクション・モードの"感度の設定"を使用して測定の感度を上げてください。

### 10-3. 提供可能な検量線

現在、弊社で提供可能な検量線は次のとおりです。

- (1) ソリッド用検量線
  - ①下地上にプライマー塗装②下地上にプライマー塗装し、さらにその上にソリッド塗装
- (2) メタリック用検量線
   ①下地上にプライマー塗装し、さらにその上にメタリック塗装
   ②下地上にプライマー塗装し、さらにその上にパール塗装、クリア塗装
   ④下地上にプライマー塗装し、さらにその上にパール塗装、クリア塗装
- (3) プリント基板用検量線エポキシ基板上の銅箔の上に施されたレジストの厚さ
- (4) ABS上のアクリルラッカー塗装グレーの塗装による検量線
- \* 塗料の種類、塗装方法などにより測定不能であったり、値が合わない可能性もあります。

# 11. 取り扱い上の注意

11-1. 標準サンプル



標準サンプルは大切に扱ってください。 測定面が傷つくと、正確なキャリブレーション ができなくなります。

11-2. プローブ



プローブのスライドベースは、いつもきれいにしておいてください。
 スライドベースの動きが悪くなると、再現性が劣化することがあります。
 このような場合は、スライド部にカップラントが進入していることが考えられます。
 図-26の要領で分解し、きれいに掃除してください。
 \* 他の部分は分解しないでください。故障の原因になります。





図-26



11-3. センサ

センサの先端を傷つけないようにしてください。 測定精度が低下する原因になります。

# 製品の保証とアフターサービス

### ■ 保証書

この製品には保証書がついています。保証書は当社がお客さまに、保証書に記載する保証期間内において、また記載する条件内での無償サービスをお約束するものです。記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

# ■ 損害に対する責任

この製品(内蔵するソフトウェア、データを含む)の使用、または使用不可能により、お客さまに生じた損害(利益損失、 物的損失、業務停止、情報損失など、あらゆる有形無形の損失)について、当社は一切の責任を負わないものとします。ま た、いかなる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客さまがお支払いになった、この商品の代価相当額を上限とし ます。

### ■ 定期点検

この製品の性能を確認し維持するために、定期的な点検を受けられることを推奨いたします。製品の使用頻度によりますが、年1回程度を目安とすると良いでしょう。点検は本製品をお求めになった販売店、または当社へお問い合わせください。

### ■ 修理

「故障?」と思われる症状のときは、この取扱説明書に記載されている関連事項や、電源・接続・操作などを再度お確かめ ください。それでもなお改善されないときは、本製品をお求めになった販売店、または当社へご連絡ください。

### ■ 校正証明書

当社の製品はISO 9001 、品質マネジメントシステムに準拠して製作されています。お客さまのご要望によって校正証明書の発行が可能ですが、製品の種類、状態によっては不可能な場合があります。本製品の校正証明書発行については、お求めになった販売店、または当社へお問い合わせください。







株式会社クソト科学研究所 東京本社 東京都大田区南馬込1-8-1 〒143-8507 大阪支店 大阪市東淀川区東中島4-410 〒533-0033 札幌営業所 札幌市西区八軒一条西3-1-1 〒063-0841 出台営業所 仏台市書菓CIヨ町産島ビル 〒980-0802 石屋営業所 名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル 〒450-0002 も休留県鳥栖市布津原町14-1 布津原ビル 〒841-0053 ● URL http://www.kett.co.jp/ ●E-mail sales@kett.co.jp

0709·AI·0206·005